

桂林电子科技大学 2023-2024 学年 第 1 学期

计算机组成原理 B 实验报告

实验名称	存储系统设计			辅导教师意见： 成绩 教师签名：
院 系	计算机与信息安全学院	专业	软件工程	
学 号	2200350204	姓名	李禹佳	
同 作 者				
实验日期	2023	年	11 月 25 日	

一、实验目的和要求

1. 实验目的

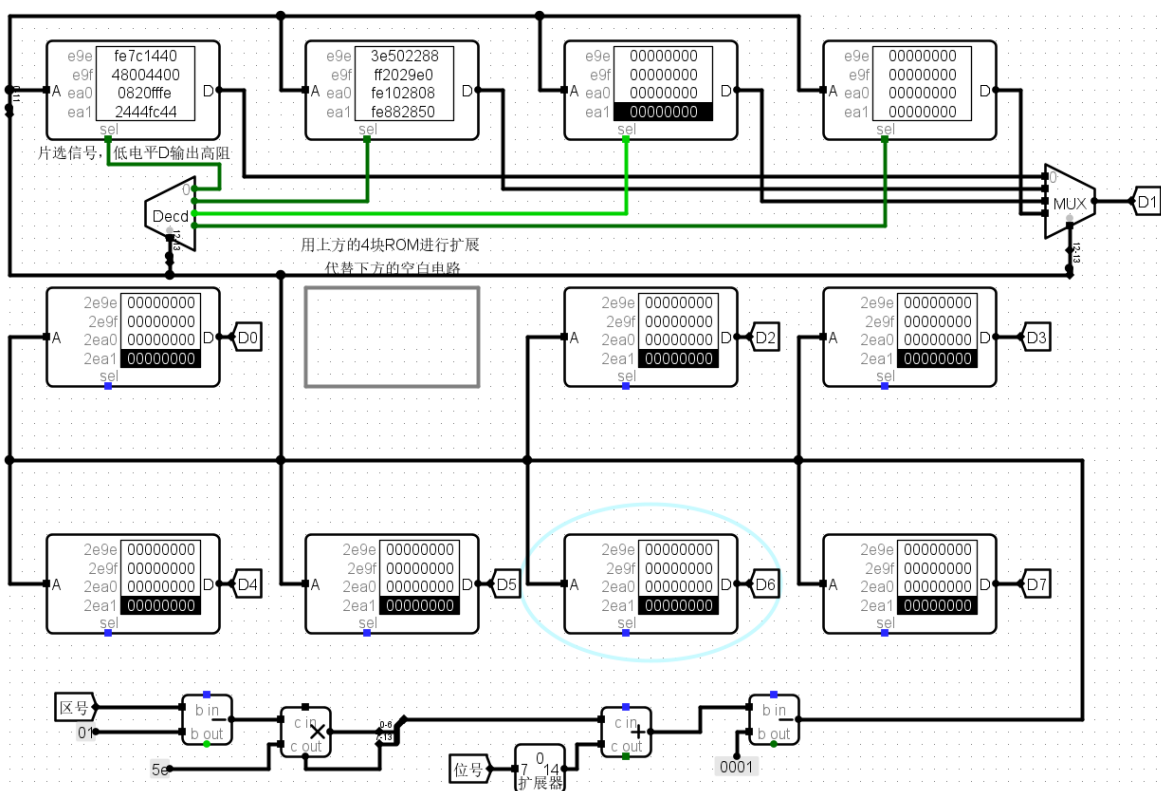
- (1) 掌握算术逻辑运算单元 (ALU) 的基本构成；
- (2) 掌握 Logisim 中各种运算组件的使用方法，熟悉多路选择器的使用；
- (3) 掌握 ALU 的设计和仿真方法。

2. 实验要求

- (1) 实验前，完成 Logisim 软件使用学习，并预习实验内容，准备好 ALU 设计方案；
- (2) 独立完成 ALU 设计，在头歌平台完成指定闯关任务；
- (3) 如实记录实验设计步骤，并对实验过程及结果进行分析总结，撰写实验报告。

二、实验步骤

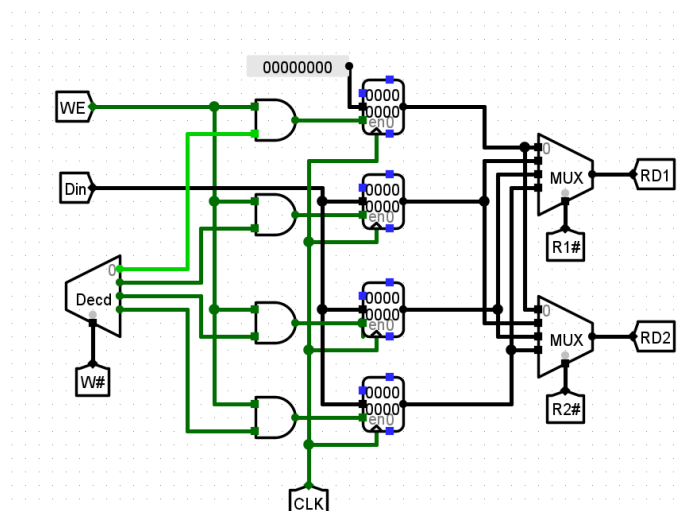
1. 第 1 关：汉字字库存储芯片扩展实验



根据题中描述，用四片小容量（4K*32 位）来代替原有（16K*32 位），将四片小容量 ROM 地址端并联，将并联后的地址段在分线器的 0~11 端，通过高两位链接译码器的输入端来分别与四个 ROM 的 sel 端连接，最后导入数据至所有 ROM，HZK16_1.txt 中的 1~4096 个数据放到 0 号 4K 的 ROM 中，4097~8192 个数据放到 1 号 4K 的 ROM 中，8193~12288 个数据放到 2 号 4K 的 ROM 中，12289~16384 个数据放到 3 号 4K 的 ROM 中，地址线通过分线器来进行分离，其中还需要对其中的数据进行调整，分为高 2 位和低 14 位，高位为 1，低位为 0。对于片选信号进行连接，加入译码器，其中译码器位宽为 2，可选为 00，01，10，11 四个信号。检验故障，位宽不匹配解决。

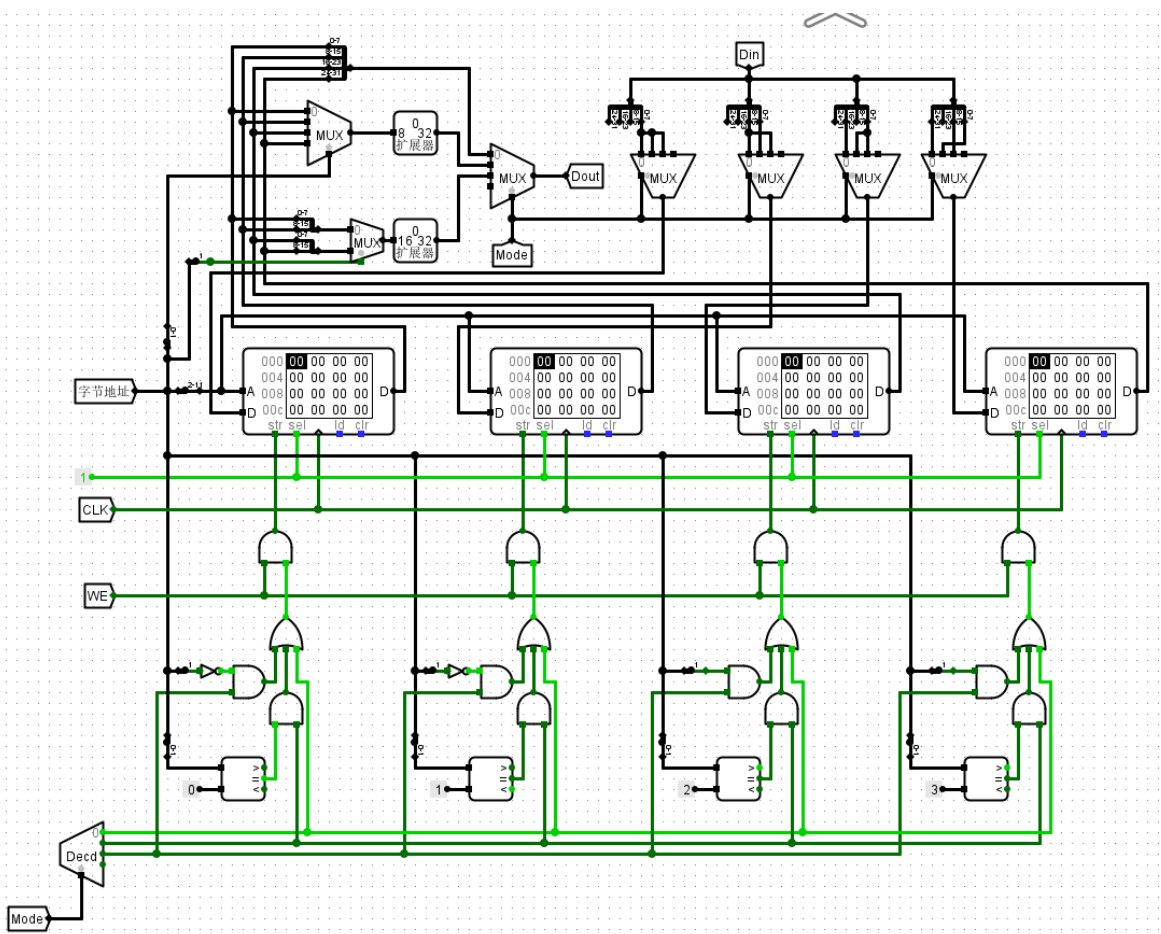
2. 第 2 关：MIPS 寄存器文件设计

实现写入数据:



电路通过 R1#,R2#这两个信号来指定读取哪两个寄存器，值由 RD1,RD2 进行输出。在写寄存器时，要求 WE,W#信号有效，从 Din 输入引脚写入数据。同时 WE 有效，在时钟脉冲下，将 Din 端数据写到寄存器文件中。在指令执行时，通过分线器，将相应位提取出，在最终指令执行之后，数据被送到 Din 端，在 RegWrite 使能信号有效后再下一个时钟将指定寄存器的数据写入。写入时根据 W#收到的写入寄存器编号利用多路选择器选择寄存器

3. 第3关：MIPS RAM 设计



Din组成				Dout组成					
字写入	Byte3	Byte2	Byte1	Byte0	字读出	Byte3	Byte2	Byte1	Byte0
高半字写入			Byte3	Byte2	高半字读出			Byte3	Byte2
低半字写入			Byte1	Byte0	低半字读出			Byte1	Byte0
最高字节写入				Byte3	最高字节读出				Byte3
次高字节写入				Byte2	次高字节读出				Byte2
次低字节写入				Byte1	次低字节读出				Byte1
最低字节写入				Byte0	最低字节读出				Byte0

其中 Dout 的输出为：

字读出：4 个 ROM 分别给 Dout 提供一个字节数据

高半字读出：低十六位有效，3，2

底半字读出：低十六位有效，1，0

最高字节读出：最低八位

次高字节读出：最低八位

最低字节读出：最低八位

其中 Din 的输出为：最低八位

字写入：将 32 位数据放在 32 位引脚，将四个字节写入四个 ROM 组件中

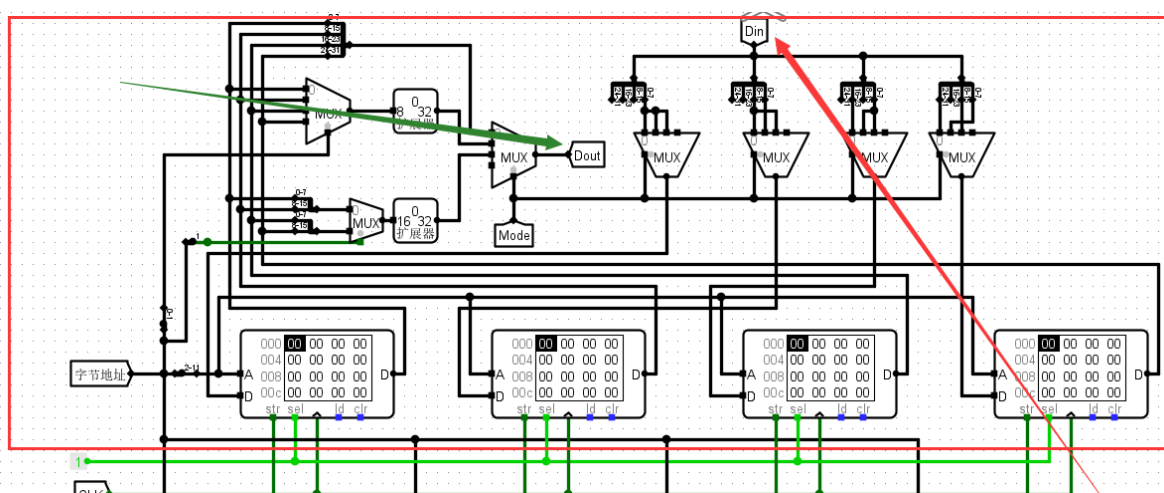
高半字写入：低十六位有效，3，2

底半字写入：低十六位有效，1，0

最高字节写入：最低八位

次高字节写入：最低八位

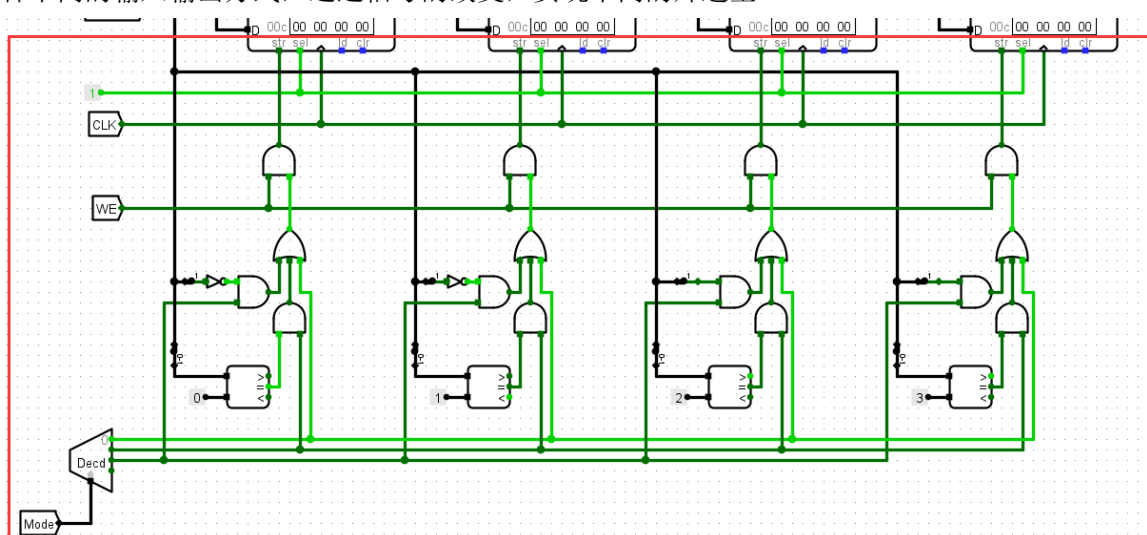
最低字节写入：最低八位



由数据选择器实现接线

引脚	输入/输出	位宽	功能描述
Addr	输入	12	字节地址（字访问半字访问时应硬件强制对齐）
Din	输入	32	写入数据，不同访问模式有效数据均存放在最低位，高位忽略
WE	输入	1	写使能，高电平有效
CLK	输入	1	时钟信号，上跳沿有效
Mode	输入	2	访问模式 00: 字访问, 01: 字节访问, 10: 2字节访问
Dout	输出	32	输出数据，不同访问模式有效数据均存放在最低位，高位忽略

由上可知，当为字输入输出时，即 $Mode=00$ ，此时直接输入输出 32 位。当为字节输入输出时，即 $Mode=01$ ，此时只需输入和输出 1Byte 的数据，并且该 Byte i 一定放置在 4 个字节的最低位在 Din 中 Byte i 由片选信号 wi 决定；在 $Dout$ 中，由字节地址的最低两位来确定。当为半字节输入输出时，即 $Mode=10$ ，此时需要选择两个 Byte 的数据，分别是 01 或者 23，而他们的相对位置是确定的。在 Din 中，0 和 2 连接低 8 位，1 和 3 连接高 8 位，具体片选由 wi 决定；在 $Dout$ 中，由第二低位来确定。 $Mode$ 和 Wi 引脚设置，先用解码器，将 $Mode$ 值转化为对应的信号，再根据三种不同的输入输出方式，通过信号的改变，实现不同的片选型



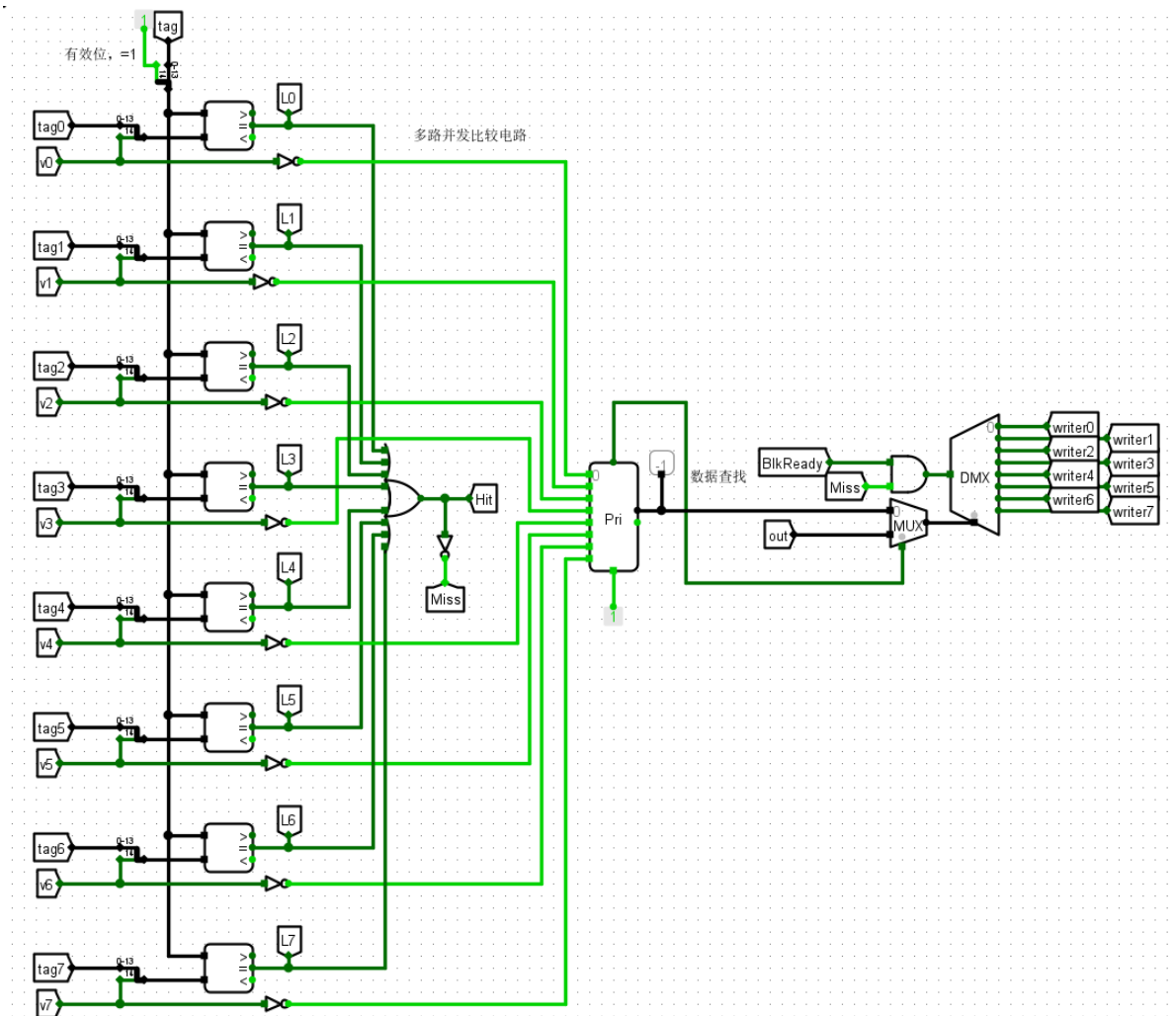
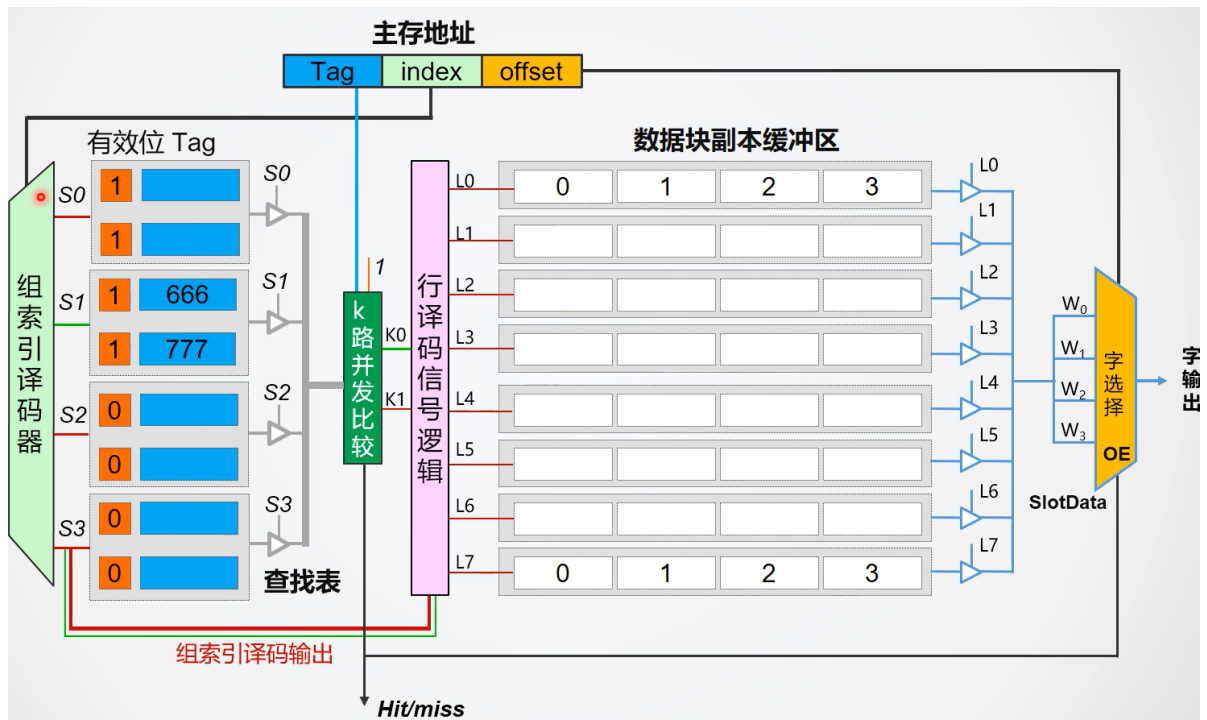
由于取字节地址，取 2~11 位，分别接入 4 片 ROM 中使能端由片选型号 wi 来决定是否有效，输入端位由 di 来输入数据

4. 第 4 关：全相联 cache 设计

实现全相联映射，可以直接存储而不用固定存储哪一行，命中率和存储率较高。主存中的任何一个数据块都可以放置在 cache 的任意一个数据块中。为了方便查找，主存数据块载入时，还需要记录若干的标记标志信息，主要包括有效位、主存块地址标记、脏数据标记位、淘汰计数等信息。

其中 cache 8 行，每个 cache 4 字节，offset 2 位，Tag 为 14 位。

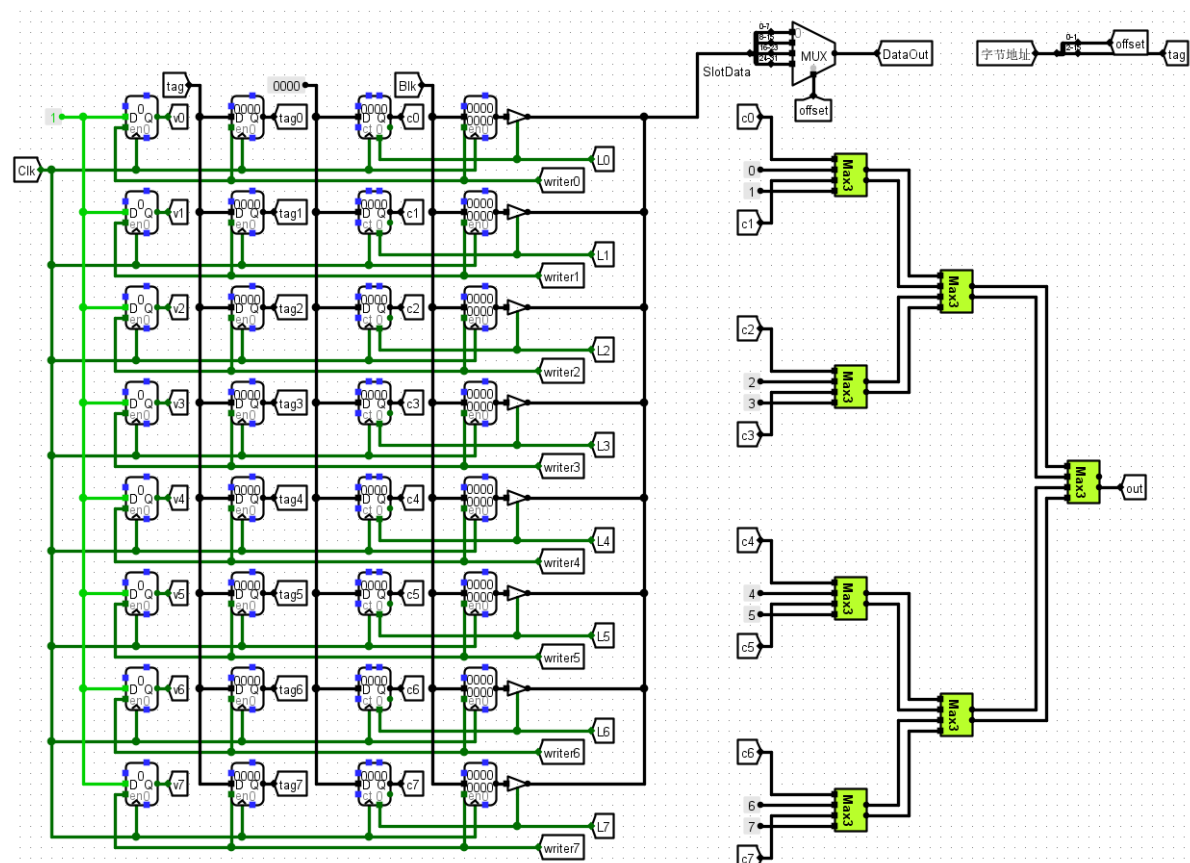
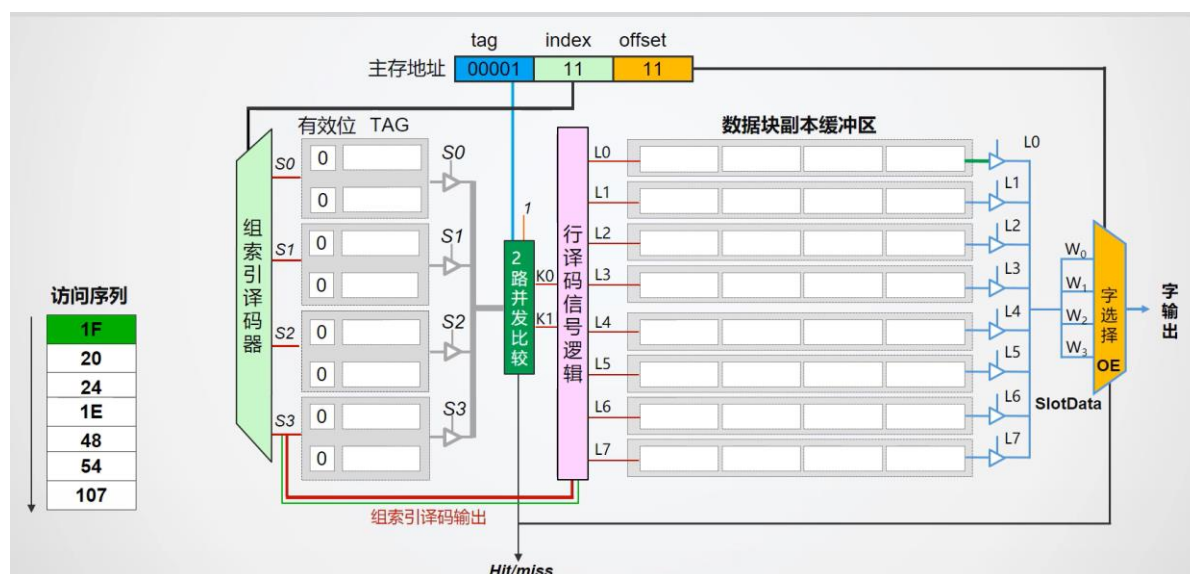
数据查找和访问逻辑：



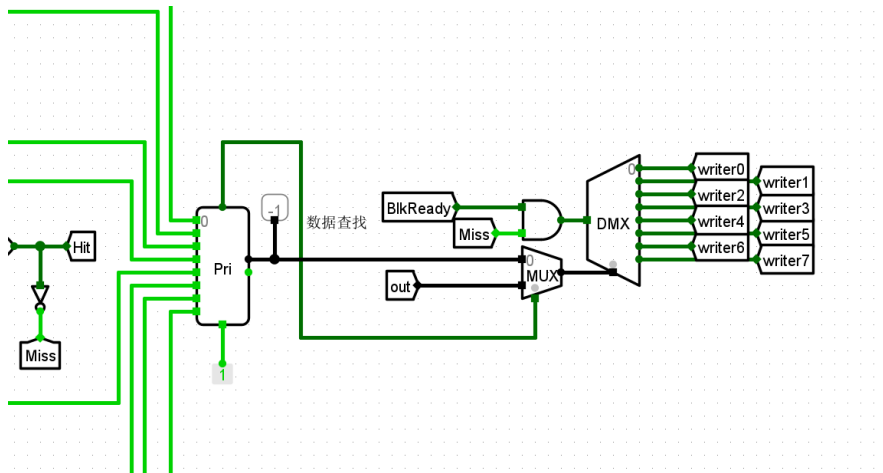
按图接入电路，使用或门将比较信号转换为打入信号（将 tag 和所有的 tag 寄存器里的值 x

进行比较。某一行比较结果相同时，且有效位为 1 时，对应行的比较结果输出为 1），使用多路并发比较电路，输入行移码信号逻辑器写入该行。

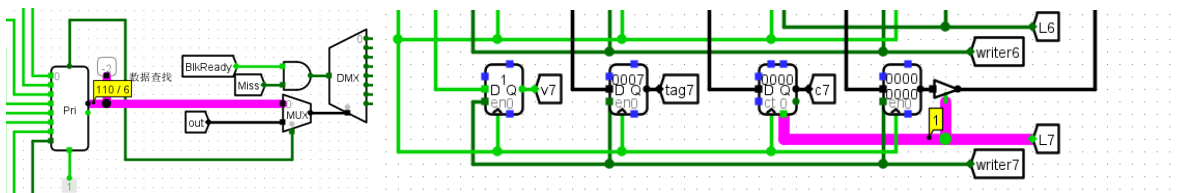
数据载入逻辑：



与直接相连一致，将所有的行淘汰数值归并得到最大值编号，如果需替换计数器最大行（载入 8 行数据）应改变行数。使用优先编码器，如果 8 行都载入数据了（也就是优先编码器输入为 0000 0000），那么就会使得 full 置为 1，否则就输出位数最小的空闲行。当 blk ready 并且 miss 的时候，向空闲行或者要淘汰的行写数据。

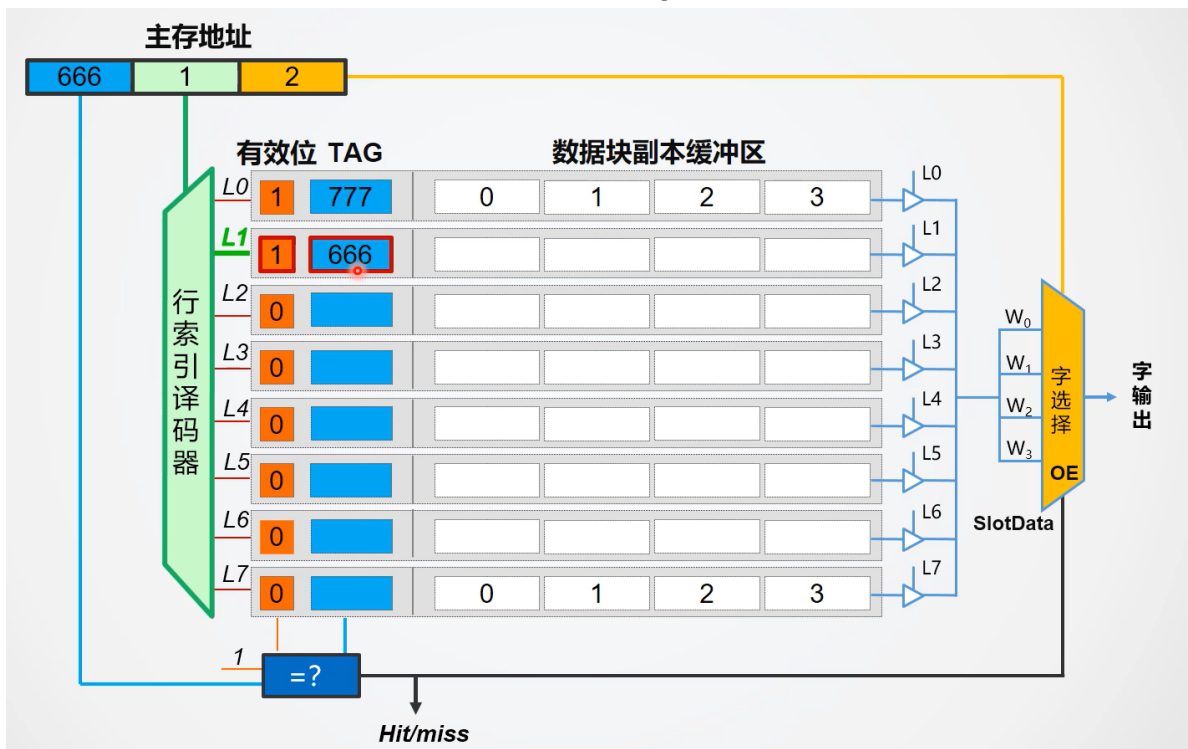


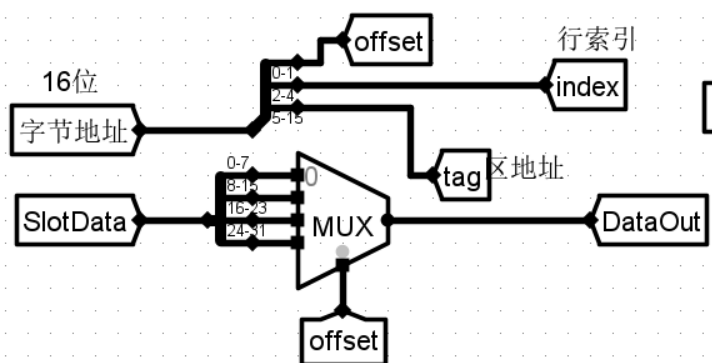
输入 1F，打入第七行，显示打入信息



5. 第 5 关：直接相联 cache 设计

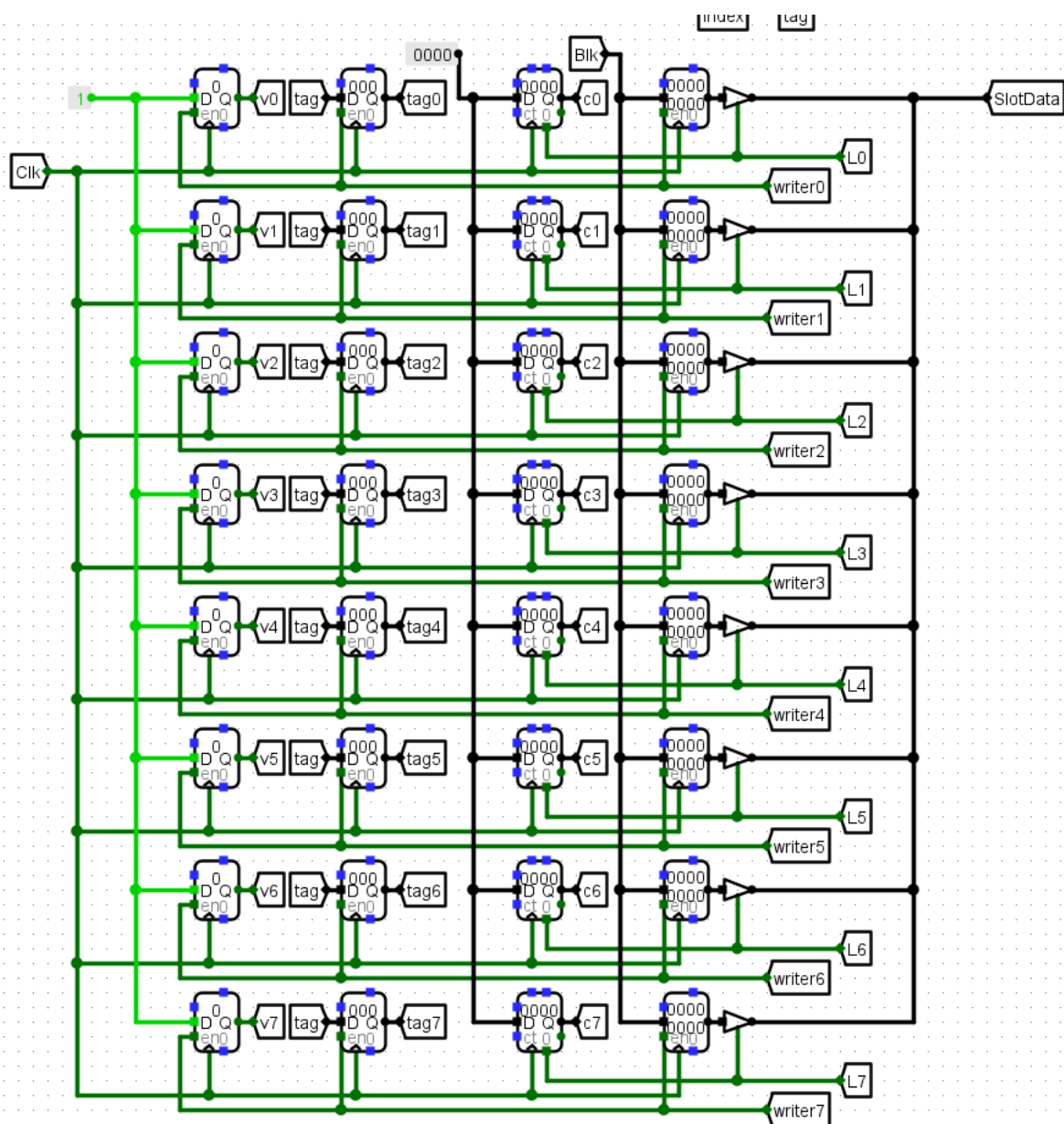
cache 有 8 行，4 字节，offset = 2，index = 3，tag = 11





Cache 行主要包括三种寄存器：valid，tag，数据块副本。当该行被选中时，将输出的值存到与之对应的标签。当 blkready=1 时，且该行被选中时，有效位置 1。

框部分为主存地址分配与 slotData 输出，旁边为字选择部分，下方为行地址译码器和比较器

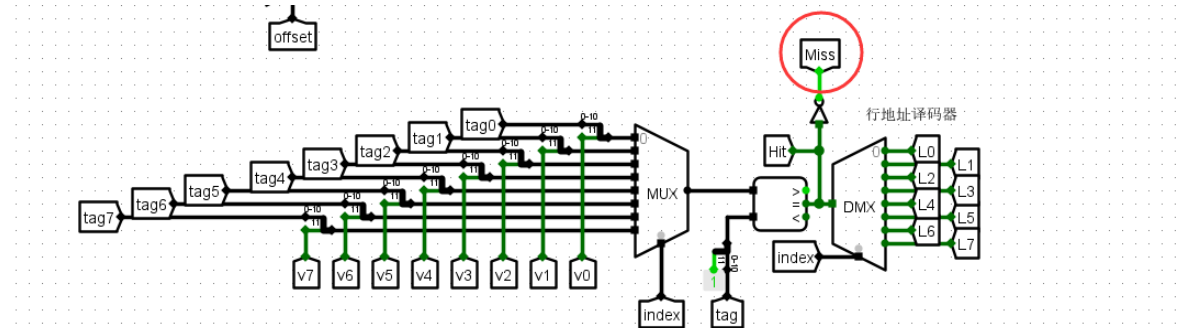


为缓冲区。行选中信号只用来控制数据块副本的输出。由于采用的是 LRU 算法，即近期最少使用

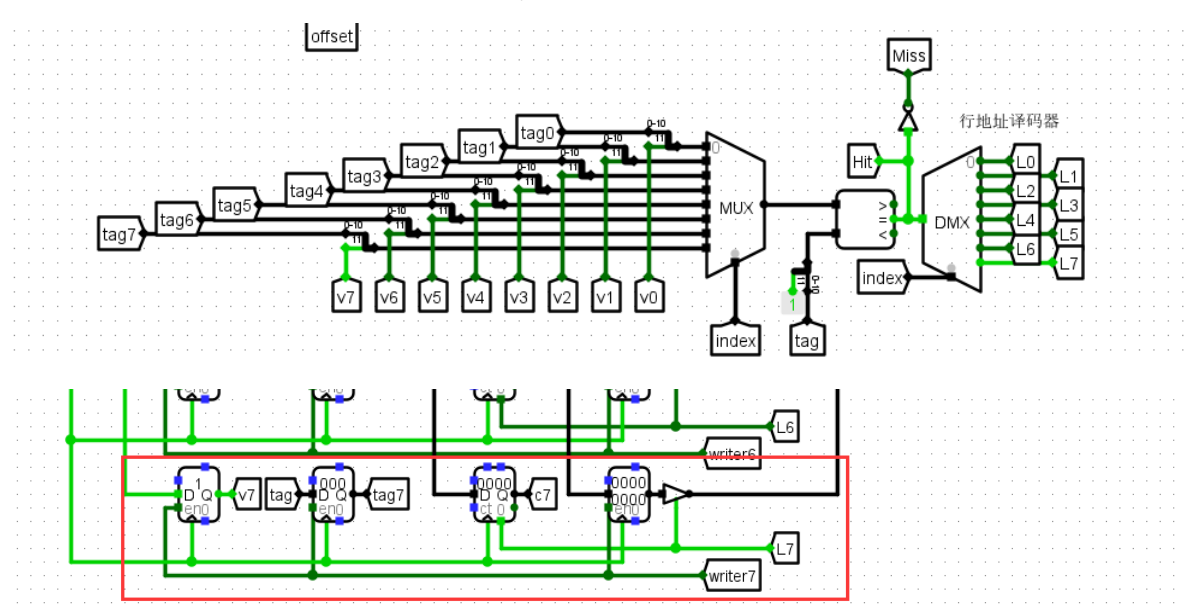
算法。当行被选中时，我们就将计数器清 0。随着时间的增大，如果某行 cache 块用的比较少，那么淘汰计数器的值就会比较大。

根据接线图可画出接线电路，tag 为区地址，为前 11 位，index 为行索引，在行地址译码器中找到对应行为区地址后面三位，offset 为字偏移地址，在后判断输出，为最后两位。

接好线后使用用例 1F 检测：

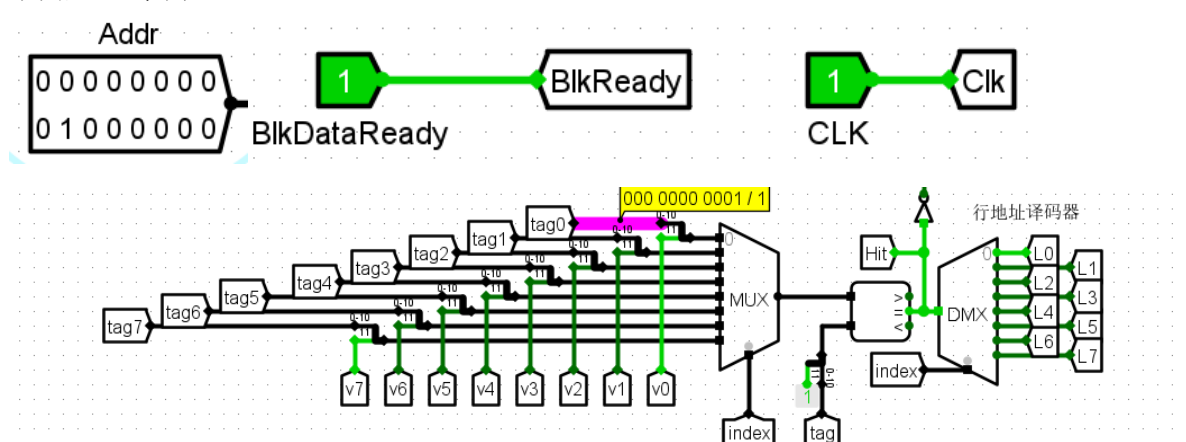


因为 cache 中为空，miss，在 BlkDataReady 为 1 的情况下 clk 置 1，后打入 hit 为 1，找到 L7

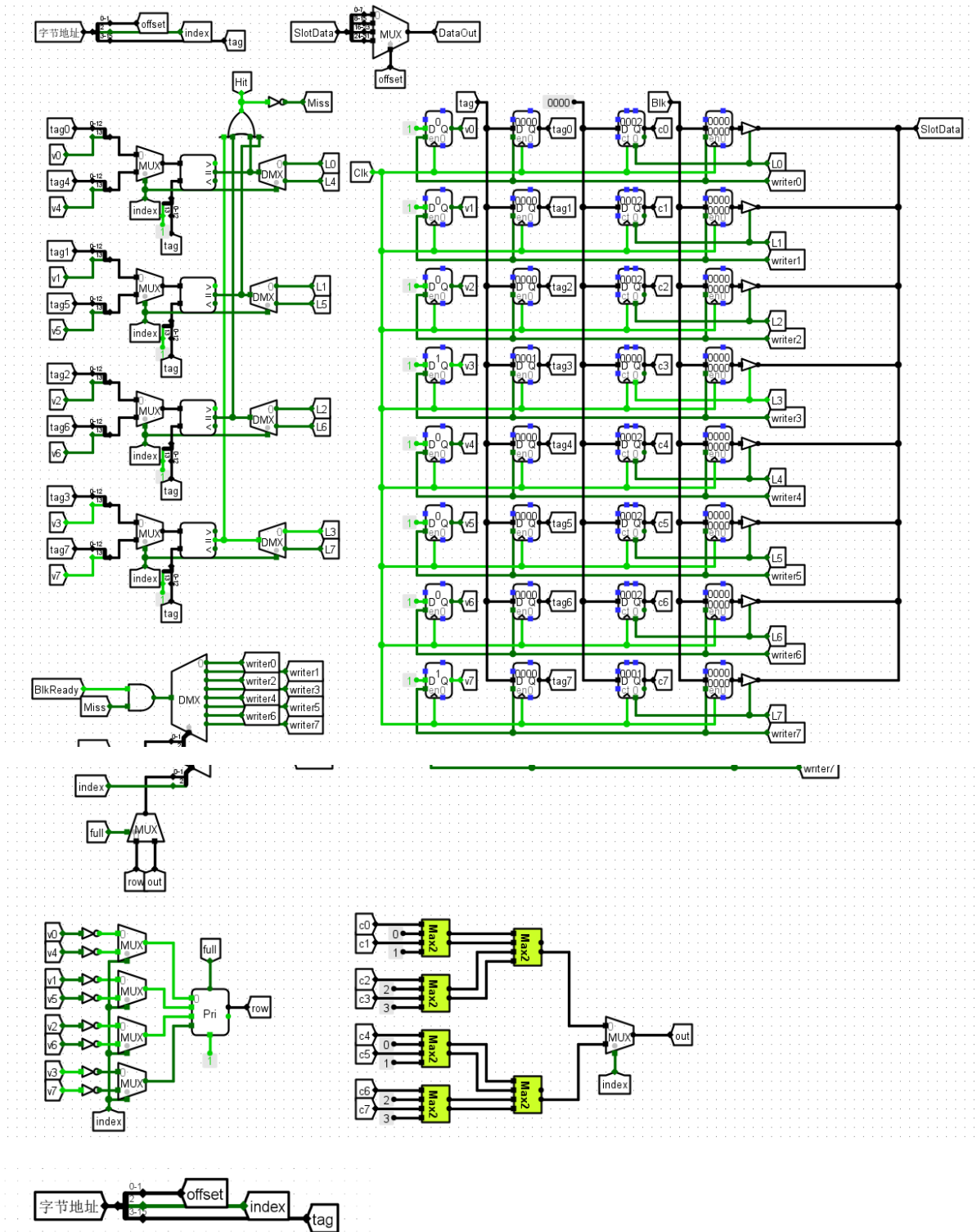


改变有效位为 1，tag 为 0000

下面是 20 举例

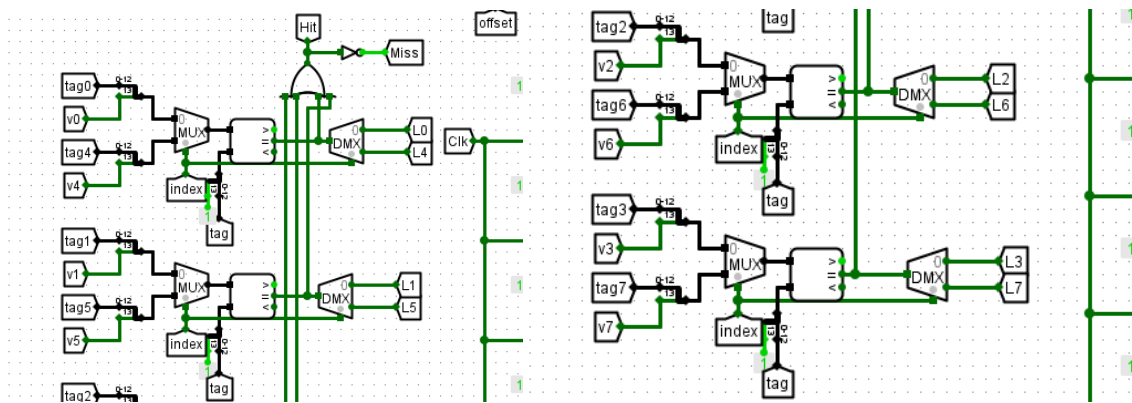


6. 第 6 关：4 路组相连 cache 设计



将主存地址按照一定的规则分成标记(tag)、组索引(index) 和块偏移(offset) 三个部分, 将标记和组索引|分别与缓存中的每个组的标记和索引进行比较, 确定需要访问的组, 4 路组相连缓存是将缓存地址空分成多个组, 每个组包含 4 个缓存行每个组有个标记(tag)和一些数据(data) , 标记用于标识该组中的缓存行是否包含所需的数据

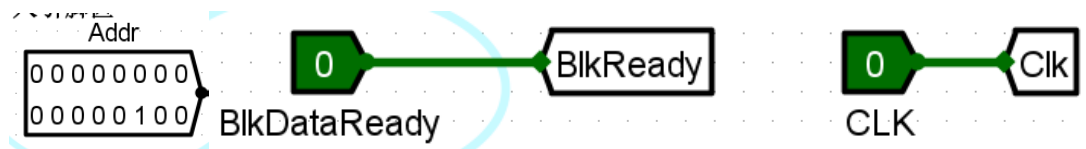
当 CPU 需要访某个地址时，缓存控制器会根据地址的标记来确定该地址是否在缓存中



找到访问的组，在该组中查找数据，如果命中 hit 则直接访问，不命中 miss 则缓存中为空，没有该信息，这时将这个数据的以及这个数据的下三位存入一个组中，组数随机检验：

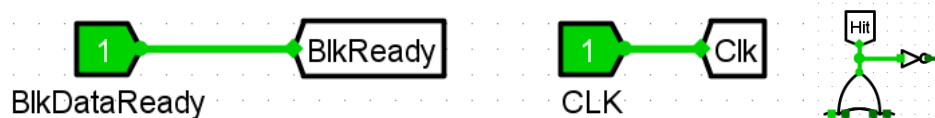
将 0100 打入并测试 0110，1000 是否在其中

将 Addr 处置为 0100

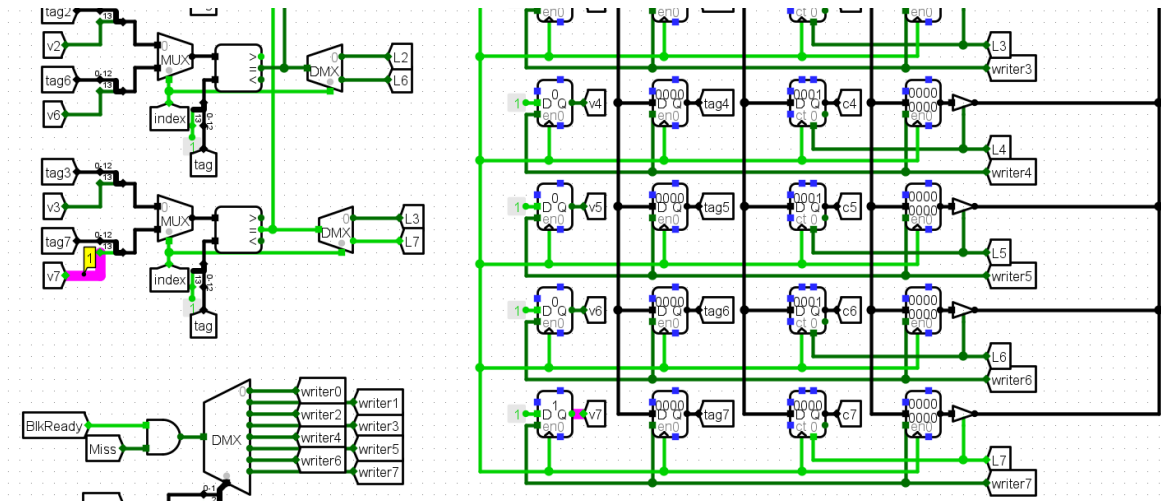


显示 miss，所有组中没有 0100

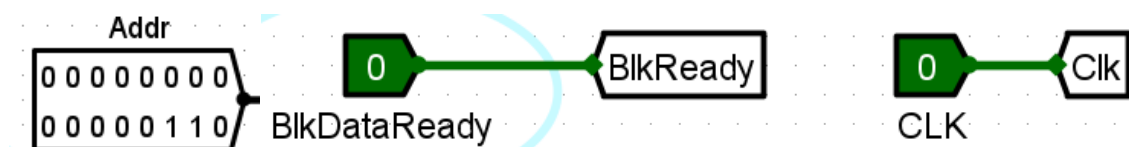
点击 BlkDataReady 开始运行后，将时钟置为 1



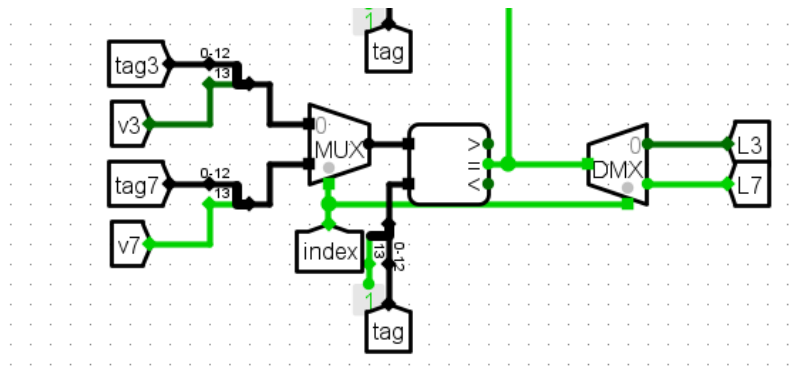
显示 hit 已打入，打入的组为 v7



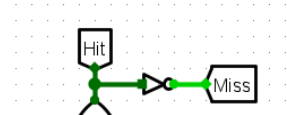
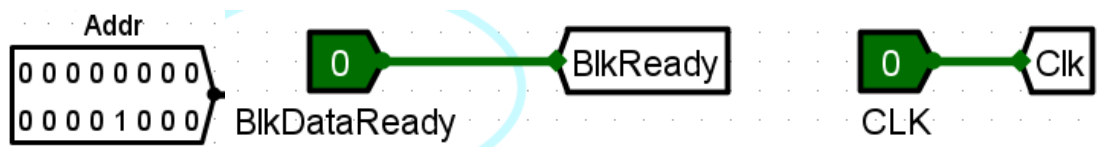
关闭 BlkDataReady，时钟，将 Addr 调至 0110



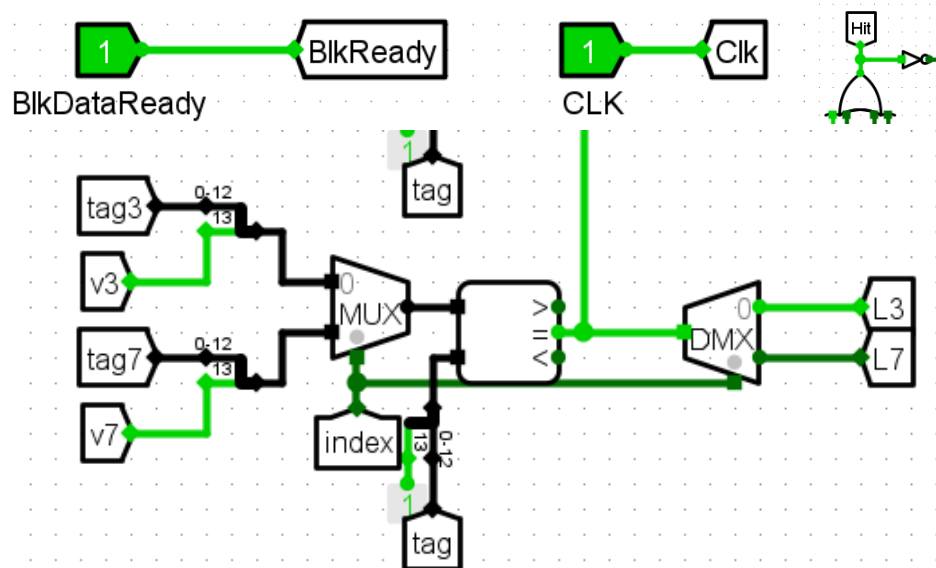
显示 hit，表明组中有这个数据，且这个数据在 v7 中



将 Addr 调至 1000

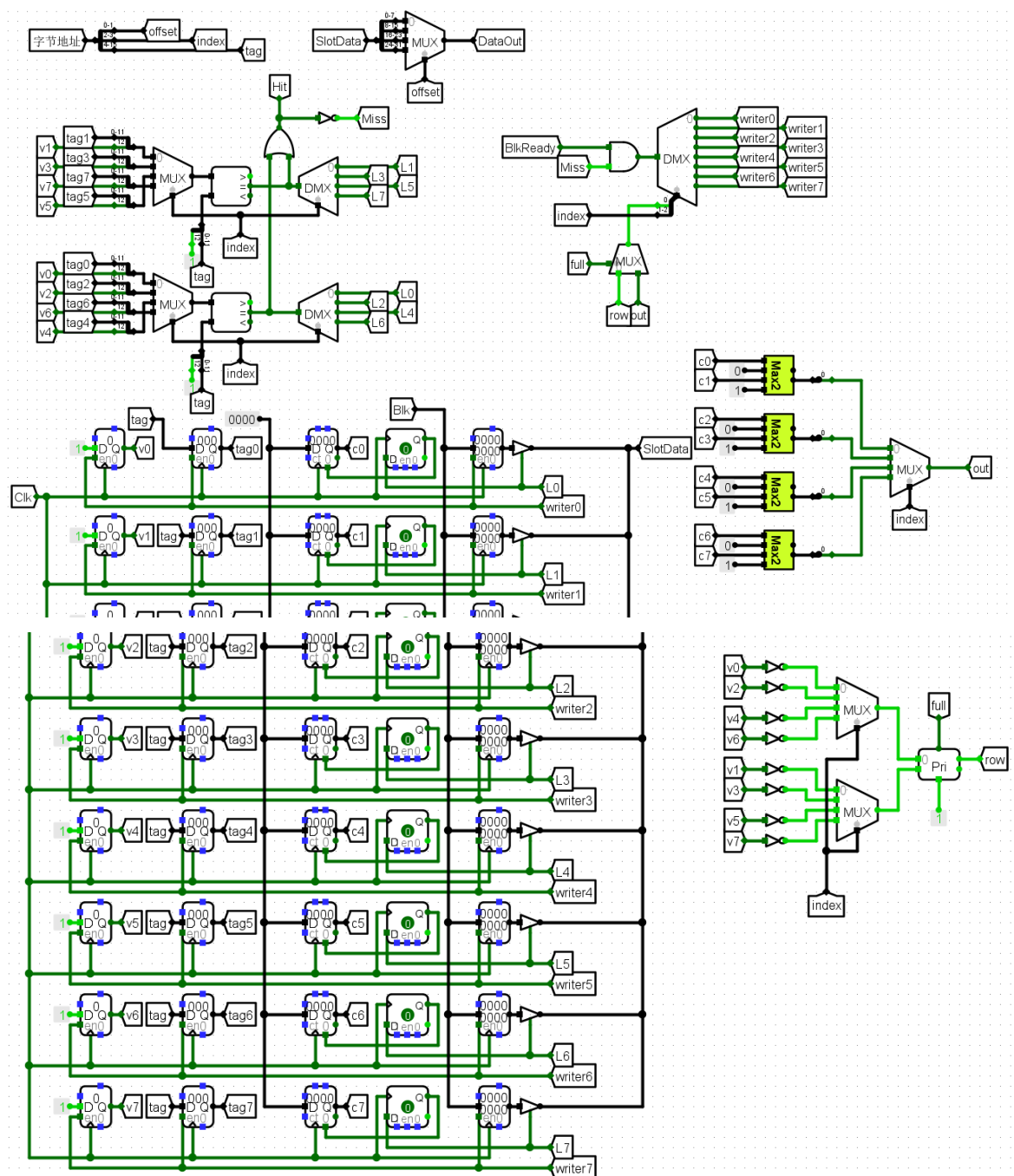


显示 miss，此时已超出存储的四个位置，故想要存储只能再次打入



打入后分配至 v3 组中
测试成功

7. 第 7 关：2 路组相联 cache 设计



将四路组相联改动组数为 2 组，可得到二路组相联

三、实验小结

1. 在 Cache 全相联中未考虑满 Cache 时的替换，后加入 out 判断
2. 未考虑到有效位导致结果错误
3. 使用器件不习惯，某些器件，引脚需要搜索才能使用
4. 数据位宽不匹配现象，通过调试改变得出结果